

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
<b>適用規格</b>									
<b>定格</b>	使用温度範囲	-55℃～85℃ (注1)			保存温度範囲	-10℃～60℃ (注2)			
	電圧	AC 125 V			使用湿度範囲	40%～80%			
	電流	0.5 A			保存湿度範囲	40%～70% (注2)			
<b>性能</b>									
	<b>項目</b>	<b>試験方法</b>			<b>規格</b>			<b>QT</b>	<b>AT</b>
<b>構造</b>	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
<b>電氣的性能</b>	接触抵抗	100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。			45 mΩ以下			○	-
	低電圧、低電流下の接触抵抗	20 mV 以下、1 mA (DC または 1000 Hz) で測定する。			55 mΩ以下			○	-
	絶縁抵抗	DC 250 V で測定する。			100 MΩ以上			○	-
	耐電圧	AC 300 V の電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	-
<b>機械的性能</b>	繰り返し動作	500 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	耐振性	周波数 10～55 Hz, 全振幅 1.52 mm, 3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs 以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	耐衝撃性	加速度 490 m/s <sup>2</sup> , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向各 3 回試験する。						○	-
<b>環境的性能</b>	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95% 中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上			○	-
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→10～15→30→10～15 分 を 5 サイクル試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-
	塩水噴霧	濃度 5% の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗: 55 mΩ以下			○	-
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)			② はなはだしい腐食がないこと。			○	-
	はんだ耐熱性	はんだ槽の場合: はんだ温度 260±5℃ 浸せき時間 10±1秒間			外観の変形及び端子などに著しいガタのないこと。			○	-
		はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内						○	-
はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃, 浸せき時間 2 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95% 以上が新しいはんだでぬれていること。			○	-	
<b>備考</b>					製 図	担 当	検 図	承 認	出 図
注1. 通電時の温度上昇を含みます。 注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。									
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
<b>HRS</b> ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			<b>製品規格表</b>			製品名 FX2C1-**-P-1.27DSAL (71)			
IBCL CL		図番 SLC4-083048-21			製品コード CL572			1	1